

フォトルミネッセンスによる シリコン結晶中の不純物濃度測定方法

正 誤 票

区分	位 置	誤	正
本体	3.2 (4)	$I = \left(\frac{D_2}{d_2} \right)^2 (L - L_1) + \left(\frac{L_1}{3d_2} \right) (D_2^2 + D_2D_1 + D_1^2) - \left(\frac{l_1}{3d_2} \right) (d_2^2 + d_2d_1 + d_1^2) + l_1$	$I = \left(\frac{D_2}{d_2} \right)^2 (L - L_1) + \left(\frac{L_1}{3d_2^2} \right) (D_2^2 + D_2D_1 + D_1^2) - \left(\frac{l_1}{3d_2^2} \right) (d_2^2 + d_2d_1 + d_1^2) + l_1$
	6.2 図 5 (スペクトルに 付記された左か ら 2 番目の記 号)	B _{TO} (b ₂ ')	P _{TO} (b ₂ ')

平成 18 年 4 月 3 日作成